

CHAKER OUNI

+21652488429 ounichaker92@gmail.com Tunis , Tunisia

A PROPOS DE MOI

Thésard en physique avec une solide formation en développement web et une expérience de freelance. Compétent en React.js, Node.js, Express.js, et Laravel. Maîtrise de logiciels tels que Photoshop, Figma et les outils MS Office. Trilingue en anglais, français et espagnol.

COPETENCES

Compétences en Laboratoire :

Manipulation sécurisée des produits chimiques, synthèse des matériaux, photolithographie, croissance cristalline

Compétences Techniques :
Analyse de données, spectroscopie,
microscopie, expériences de physique des
particules

Maîtrise des Logiciels :
MS Office (Word, Excel, PowerPoint), MATLAB,
Origin, Python, Power BI, figma,photoshop

Compétences Mathématiques :
Calcul avancé, analyse statistique, modélisation
mathématique

** Développement Web:**

- **Front-end :** React.js, Next js

- **Back-end: ** Node.js, Express.js, Laravel

- **Outils :** Git, Docker

LANGUES

Anglais (Niveau B1)
Frensh(Niveau B2)
Espagnol(Niveau A2)

EDUCATION

Janvier 2021-Septembre 2022 Thesard chercheur en physique

Technopole Borj Cedria, Laboratoire de Photovoltaique, Tunisie - Réalisation d'expériences impliquant des réactions chimiques, la caractérisation des matériaux et la physique

des particules.

- Analyse et interprétation des données scientifiques pour soutenir les résultats de recherche.
- Gestion sécurisée des produits chimiques et élimination conforme aux protocoles de sécurité du laboratoire.
- Assistance à la préparation de publications et présentations scientifiques.

Janvier 2018-Juillet 2020

Mastere de recherche en physique des materiaux Faculté des Sciences de Tunis, Tunisie

- Recherche sur les matériaux avancés, la physique d semi-conducteurs et la physique des particules.
- Développement et mise en œuvre de protocol expérimentaux pour la synthèse et la caractérisation d matériaux.
- Utilisation de techniques d'analyse de données po interpréter les résultats expérimentaux.
- Concentrement sur les principes de base de la physique des matériaux et de la croissance cristalline.
- Présentation des résultats dans des contextes académiques.

Septembre 2014 - Juin 2017

Licence en Physique

Faculté des Sciences de Tunis, Tunis, Tunisie

Au cours de ce programme, j'ai acquis des connaissances fondamentales en physique ainsi qu'en chimie organique et inorganique, en principes atomiques et cristallographiques en mécanique classique et quantique, en astrophysique, ainsi qu'en physique statistique et thermodynamique.

EXPERIENCE PROFFESSIONNELLE

Janvier2022-Present

Freelancer en Développement Web

- Développement de sites web et d'applications web pour divers clients en utilisant React.js, Node.js, Express.js et Laravel.
- Création de maquettes et prototypes avec Figma et Photoshop.
- Gestion de projets de bout en bout, de la conception à la livraison.

Septembre 2019-Decembre 2021

Stage en Laboratoire de Photovoltaique

Faculty of Sciences of Tunis, Tunis, Tunisia

Caractérisation de Couches Minces de TiO2 par Réflectométrie des Rayons X

Dans le cadre de ma recherche de Master à la Faculté des Sciences de Tunis, Tunisie, je me suis concentré sur la caractérisation des couches minces de TiO₂ en utilisant la réflectométrie des rayons X (XRR). Ce projet visait à étudier les propriétés structurelles et optiques des couches minces de TiO₂, qui sont cruciales pour leurs applications en photovoltaïque et en photocatalyse.

Responsabilités Clés et Réalisations :

- **Synthèse et Préparation:**
- Dépôt de couches minces de TiO₂ sur divers substrats en utilisant des techniques telles que le procédé sol-gel et le spin coating.
- Optimisation des paramètres de dépôt pour obtenir des couches minces uniformes et de haute qualité.
- **Techniques de Caractérisation :**
- Utilisation de la réflectométrie des rayons X (XRR) pour mesurer l'épaisseur, la densité et la rugosité de surface des couches minces de TiO₂.
- Analyse des données XRR pour déterminer les propriétés structurelles du film, en assurant une haute précision et exactitude.
- Complémentation de la XRR par d'autres techniques de caractérisation telles que la Microscopie à Force Atomique (AFM) et l'Ellipsométrie Spectroscopique pour fournir une compréhension globale des propriétés du film.
- **Résultats et Impact :**
- Caractérisation réussie des couches minces de TiO₂, révélant leur haute qualité et leur adéquation pour les applications photovoltaïques.
- Identification de la corrélation entre les paramètres de dépôt et les propriétés résultantes du film, contribuant à l'optimisation du processus de fabrication des couches minces.
- **Article Scientifique :**
- Préparation d'un article scientifique intitulé "Caractérisation de Couches Minces de TiO₂ par Réflectométrie des Rayons X," actuellement en cours d'examen pour publication. Cet article détaille la méthodologie, les résultats et les implications de l'étude, soulignant l'importance de la XRR dans l'analyse des structures de films minces.